# 精密电容测试仪

## TH2640系列 耐冲击精密电容测试仪

### 性能特点

- 高稳定性和一致性: 20个量程配置
- 高功率:信号电平: 20V<sub>AC</sub>/100mA<sub>AC</sub>
- 高速度: 测试速度高达10ms(100次/秒)
- 高分辨: 10.1英寸,分辨率1280\*800,电容式触摸屏
- 点测、列表扫描、图形扫描三种测试方式
- 四参数测量
- 201点多参数列表扫描功能
- 图形扫描功能, 4轨迹任意选择, 支持1/2/4分屏
- 分选功能: LCR模式10档分选
- · 耐冲击: 抗冲击电压高达200V
- 高兼容性:支持SCPI/MODBUS指令集, 兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A

### 应用

• 无源元件:

电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。

• 半导体元件:

LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的 $C ext{-}V_{DC}$ 特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析

• 其它元件:

印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估



**NEW** 

| 4=#0 | RS232   | √        | USB HOST | √ | USB DEVICE | <b>√</b> |
|------|---------|----------|----------|---|------------|----------|
| が自じ  | HANDLER | <b>√</b> | LAN      | √ | 外部DCI      | √        |

#### TH2640系列

体积(mm): 430(W)×177(H)×265(D)

净重: 11kg

• 介质材料:

塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估

• 磁性材料:

铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估

• 半导体材料:

半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性

### 技术参数

| 产品型号          |                  | TH2640A   |                         | TH2640B    |  |  |
|---------------|------------------|---|-------------------------|------------|--|--|
| 显示            | 显示器              | 10.1 英寸电容触摸屏  |                         |            |  |  |
|               | 比例               | 16:9  |                         |            |  |  |
|               | 分辨率              | 1280×RGB×800  |                         |            |  |  |
| 测量参数          | 方式               | 四参数任意选择   |                         |            |  |  |
|               | AC               | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、 $ Z $ 、 $ Y $ 、R、X、G、B、 $\theta$ 、D、Q、 $V_{AC}$ 、 $I_{AC}$ |                         |            |  |  |
|               | 范围               | 100Hz-50  | 0kHz                    | 100Hz-2MHz |  |  |
|               | 精度               | 0.01%   | 0.01%                   |            |  |  |
|               | 分辨率              | 1mHz  | (100.000Hz-999.999Hz)   |            |  |  |
| 测试频率          |                  | 10mHz   | (1.00000kHz-9.99999kHz) |            |  |  |
|               |                  | 100mHz  | (10.0000kHz-99.9999kHz) |            |  |  |
|               |                  | 1Hz   | (100.000kHz-999.999kHz) |            |  |  |
|               |                  | 10Hz  | (1.00000MHz-2.00000MHz) |            |  |  |
| AC 测试信<br>号模式 | 额定值 (ALC<br>OFF) | 设定电压为测试端开路时 Hcur 电压   |                         |            |  |  |
|               |                  | 设定电流为测试端短路时从 Hcur 流出电流  |                         |            |  |  |
|               | 恒定值 (ALC ON)     | 保持 DUT 上电压与设定值相同  |                         |            |  |  |
|               |                  | 保持 DUT  | 上电流与设定值相同               |            |  |  |

# 精密电容测试仪

# TH2640系列 耐冲击精密电容测试仪

### 技术参数

|                  | 电压范围        | 0Vrms-20Vrms  |  |  |  |  |
|------------------|-------------|---|--|--|--|--|
| 测试电平             | <b>电压范围</b> | ±(10%×设定值 +2mV)(AC≤2Vrms)   |  |  |  |  |
|                  | 准确度         | ±(10% 及定值 +2IIV)(ACS2VIIIS)<br>±(10% 设定值 +5mV)(AC > 2Vrms)  |  |  |  |  |
|                  | 分辨率         | 1mVrms (5mVrms-1Vrms)   |  |  |  |  |
|                  |             | 10mVrms (1Vrms-20Vrms)  |  |  |  |  |
|                  | 电流范围        | 50μArms-100mArms  |  |  |  |  |
|                  | 分辨率         | 10μArms (50μArms-10mArms)   |  |  |  |  |
|                  | (20Ω 内阻)    | 100μArms (10mArms-100mArms)   |  |  |  |  |
| 测试端配置            | Ĺ           | 五端  |  |  |  |  |
| 测试电缆长            | 度           | 0m  |  |  |  |  |
| 输出阻抗             |             | 20Ω, ±4%@1kHz   |  |  |  |  |
| 数学运算             |             | 与标称值的绝对偏差 $\Delta$ ,与标称值的百分比偏差 $\Delta$ %   |  |  |  |  |
| 等效方式             |             | 串联、并联   |  |  |  |  |
| 校准功能             |             | 开路 OPEN、短路 SHORT、负载 LOAD  |  |  |  |  |
| 测量平均             |             | 1-255 次   |  |  |  |  |
| 量程选择             |             | 自动 AUTO、手动 HOLD   |  |  |  |  |
| 量程配置             | LCR         | $50m\Omega,\ 100m\Omega,\ 200m\Omega,\ 500m\Omega,\ 1\Omega,\ 2\Omega,\ 5\Omega,\ 10\Omega,\ 20\Omega,\ 50\Omega,\ 100\Omega,\ 200\Omega,\ 500\Omega,\ 1k\Omega,\ 2k\Omega,\ 5k\Omega,\ 10k\Omega,\ 20k\Omega,\ 50k\Omega,\ 100k\Omega$ |  |  |  |  |
| 测量时间(ms)         |             | 快速 : 10.4ms<br>中速 : 90.4ms<br>慢速 : 218ms  |  |  |  |  |
| 基本测量准确度          |             | 0.05%(具体参考说明书)  |  |  |  |  |
| 测量显示范            | 通           |   |  |  |  |  |
| Cs. Cp           |             | 0.00001pF-9.99999F  |  |  |  |  |
| Ls, Lp           |             | 0.00001μH-99.9999kH   |  |  |  |  |
| D                |             | 0.00001-9.99999   |  |  |  |  |
| Q                |             | 0.00001-99999.9   |  |  |  |  |
| R, Rs, R         | p、X、Z       | 0.001mΩ-99.9999MΩ   |  |  |  |  |
| G, B, Y          |             | 0.00001µs-99.9999S  |  |  |  |  |
| $\theta_{r}$     |             | -3.14159-3.14159  |  |  |  |  |
| $\theta_{\sf d}$ |             | -179.999° -179.999°   |  |  |  |  |
| Δ%               |             | ± (0.000%-999.9%)   |  |  |  |  |
| 多功能参数列表扫描        | 点数          | 201 点,每个点可设置平均次数,每个点可单独分选   |  |  |  |  |
|                  | 参数          | 测试频率、AC 电压、AC 电流  |  |  |  |  |
|                  | 触发模式        | 顺序 SEQ:当一次触发后,在所有扫描点测量,/EOM/INDEX 只输出一次   |  |  |  |  |
|                  |             | 步进 STEP:每次触发执行一个扫描点测量,每点均输出 /EOM/INDEX,但列表扫描比较器结果只在最后的 /EOM 才输出   |  |  |  |  |
|                  | 其他特点        | 1. 扫描参数与测试参数都有多种复制功能<br>2. 每个扫描点均可设置延时<br>3. 结果显示字体无极放大   |  |  |  |  |
|                  | 比较器         | 每个扫描点最多可测量四个测试参数,每个参数均可设置上下限,所有测试参数都合格输出 PASS信号,否则输出 FAIL 信号,未设上下限则不判断  |  |  |  |  |

# 精密电容测试仪

# TH2640系列 耐冲击精密电容测试仪

| 图形扫描         | 扫描点数         |    | 21-1001 任意设置  |  |  |
|--------------|--------------|----|---|--|--|
|              | 结果显示         |    | 每个参数的极值以及光标所在点的扫描参数值与对应的测试参数值   |  |  |
|              | 扫描轨迹         |    | 1-4 个测试参数任意选择,扫描曲线可以一分屏、二分屏、四分屏   |  |  |
|              | 显示范围         |    | 实时自动、锁定   |  |  |
|              | 坐标标尺         |    | 对数、线性   |  |  |
|              | 扫描参数         |    | 频率、AC 电压、AC 电流  |  |  |
|              | 触发方式         | 单次 | 手动触发一次,从起点到终点一次扫描完成,下个触发信号启动新一次扫描   |  |  |
|              |              | 连续 | 从起点到终点无限次循环扫描   |  |  |
|              | 结果保存         |    | 图形、文件   |  |  |
|              | Bin 分档       |    | 10Bin、PASS、FAIL   |  |  |
|              | Bin 偏差设置     |    | 偏差值、百分偏差值、关   |  |  |
|              | Bin 模式       |    | 容差、连续   |  |  |
| 比较器          | Bin 计数       |    | 0-9999  |  |  |
|              | 档判别          |    | 每档最多可设置四个参数极限范围,四个测试参数结果设档范围内显示对应档号,超出设定最大档号范围则显示 FAIL,未设置上下限的测试参数自动忽略档判别 |  |  |
|              | PASS/FAIL 指示 |    | 满足 Bin1-10, 前面板 PASS 灯亮,否则 FAIL 灯量  |  |  |
| 数据缓存         |              |    | 201 个测量结果可分批读取  |  |  |
| 存储调用         | 内部           |    | 约 6GB 非易失存储器测试设定文件  |  |  |
| 1分149月       | 外置 USB       |    | 测试设定文件、截屏图形、记录文件  |  |  |
| 键盘锁定         | 键盘锁定         |    | 可锁定前面板按键,其他功能待扩充  |  |  |
|              | USB HOST     |    | 2 个 USB HOST 接口,可同时接鼠标、键盘,U 盘同时只能使用一个                                     |  |  |
|              | USB DEVICE   |    | 通用串行总线插座,小型 B 类(4 个接触位置);与 USB TMC-USB488 和 USB2.0 相符合,阴接头用于连接外部控制器。      |  |  |
| 接口           | LAN          |    | 10/100M 以太网自适应  |  |  |
|              | HANDLER      |    | 用于 Bin 分档信号输出   |  |  |
|              | RS232C       |    | 标准 9 针,交叉   |  |  |
|              | RS485        |    | 可以接受改制或外接 RS232 转 RS485 模块  |  |  |
| 开机预热时间       |              |    | 60 分钟   |  |  |
| 输入电压         |              |    | 100-120VAC/198-242VAC 可选择,47-63Hz   |  |  |
| 供电电源功率       |              |    | 不小于 130VA   |  |  |
| 尺寸(WxHxD)mm³ |              |    | 430x177x265   |  |  |
| 重量(kg)       |              |    | 11kg  |  |  |
| =            |              |    |   |  |  |

## 随机附件

三芯电源线

TH26010 镀金短路板 TH26048B 测试夹具

TH26011BS 四端对开尔文测试电缆